

2026 年 5 月 15 日

致各位

公司名称 尼得科精密检测科技株式会社

代 表 人 总裁 山崎秀和

所 在 地 京都府向日市 Nidec Park 33 番地 C 栋

尼得科推出面向半导体及印刷电路板的 AI 检测与测量解决方案——外观检测设备“AURCA”系列

尼得科精密检测科技株式会社（以下简称“本公司”）将开始销售用于电子电路板和半导体硅晶圆的 AI 检测与测量解决方案——外观检测设备“AURCA”系列。



AURCA 产品外观

■ 产品开发背景

随着近年来由 AI 引领的电子设备市场不断扩大，对日益微细化、复杂化的半导体制造工艺提出了高可靠性要求。此次，作为解决制造现场课题的解决方案，我司开发了“AURCA”系列外观检测设备，以应对如传统图像检测方法难以检测的缺陷以及提高良率等课题。

■ “AURCA”系列的特点

1. **高精度缺陷检测（AI 图像处理）：**通过我们独有的 AI 算法，能够高精度地检测出传统检测方法难以识别的细微缺陷和异常。
2. **全彩色光学检测：**通过基于高水平光学设计的全彩色图像采集，准确捕捉目标物体的材质和高度变化，大幅减少误检。
3. **多光源图像单次扫描同时处理：**根据待检测缺陷优化配置多个光源进行同步扫描，瞬时检测所有类型的缺陷。

■ “AURCA” 系列提供的价值

“AURCA” 不仅限于检测不良品，还通过 AI 的高级测量和分析数据，为制造现场的良率改善做出贡献。

1. **分析缺陷的“真因”：**详细分析 AI 检测到的缺陷形状和发生趋势。不仅限于简单的合格与否判断，还支持阐明“为何会发生该缺陷”的机制。
2. **向制造工序的直接反馈：**通过将分析结果迅速反馈给前道工序，有助于重新审视制造工序和制定预防措施。
3. **实现持续提升良率的循环：**通过持续运行“检查→分析→反馈→工艺改进”这一循环，最大限度地提高客户工厂的整体良率，为降低制造成本和提高产品可靠性做出重大贡献。

【本件相关垂询】 尼得科精密检测科技株式会社

新闻稿相关垂询：事业战略组 075-280-8100

产品相关垂询：营业部 075-280-8101